

インサーキットテスタ APT-3050 シリーズ

HIGH-GRADE IN-CIRCUIT TESTER  
**APT-3050** HIGH-GRADE IN-CIRCUIT TES

ICリード浮き不良を検出するAgilent TestJet技術搭載可



APT-3050 は数々の最新テクノロジーを搭載することにより、高速・広範囲測定を実現したインサーキットテスタの最新モデルです。

外観的な検査では難しい部品の定数間違いやハンダ不良によるショート/オープンを初め、欠品、異種装着、プリント配線の断線・短絡など、基板アセンブリ工程で発生した多種多様の不良を高速且つ正確に検出します。

APT-3050T

セル生産に対応した縦長スタイルの  
コンパクト型インサーキットテスタ



APT-3050T は、APT-3050 をベースに「セル生産」を代表とする立ち作業向けに開発されたコンパクトタイプのインサーキットテスタです。

APT-3050 で使用されるオプション群も使用できます。

IN-CIRCUIT TESTER

# APT-3050H

コンパクトな計測制御ユニットも用意しています。



APT-3050 の計測制御部のみを BOX におさめました。

既にお持ちのプレスユニットや治具に接続して使用できます。

## 主な特徴

### ■ Agilent Technology 社 TestJet 技術 (オプション)

世界的に定評のある Agilent Technology 社の TestJet 技術を搭載可能です。表面実装型の IC やコネクタのリード浮きを的確に検出します。

### ■ 4 端子ケルビン測定機能を標準搭載

プローブ接触抵抗の影響を受けることなく、ヒューズ抵抗の定数間違いや微小インダクタンス部品のショート不良を検出できます。

周辺部品の影響を排除するガーディングと位相分離測定、配線やプローブ接触により生じる測定誤差のキャンセル機能などを搭載しています。また、フォトカブラの ON チェックも行えるようになりました。

ON 抵抗、耐電圧性などに優れた高速・長耐久型のリードリレーをスキマナー部に厳選使用しているため、ボードの種類を問わず測定値は安定しています。

### ■ WindowsPC に対応

OS は、信頼性の高い Microsoft 社の Windows®XP に変更できます。ネットワークなどの構築が容易で

---

あり、さらにマルチタスクをはじめとする Windows® の豊富な機能を活用できます。

測定モードやレンジ、信号印加時間、ガードピンなどを自動生成する ATG 機能を所有。また、検索機能やデータ変換機能も充実しています。

測定信号の印加時間に対する測定値を波形表示しますので高度なデバッグも容易に行えます。

## ■ 英語・中国語表示システム（オプション）

海外向けに英語・中国語版のマスタをご用意しています。

## ■ 治具簡易接続機構（オプション）

検査治具（ピンボード）を本体に設置する際、測定ケーブルをワンタッチで接続できるようになります。これにより、機種切替時間の短縮が可能です。